

事業者名	埼玉県									
機器名	三次元測定機									
写真										
特徴・用途	測定物の寸法、形状や図面とのズレ量等を非常に高い精度で測定・評価できる。									
設置場所	埼玉県産業技術総合センター									
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)	
					件数(件)	時間(時間)				
	H 26年1月									0
	H 26年2月									0
	H 26年3月	2	2	0	0	0	0	20		22
	H 26年4月	5	2	8	2	8	0	19		31
	H 26年5月	10	3	3	5	15	0	25		36
	H 26年6月	9	5	3	4	15	0	28		40
	H 26年7月	11	5	4	2	9	0	41		52
	H 26年8月	13	6	3	3	9	0	40		52
	H 26年9月	7	5	2	2	15	0	35		44
	H 26年10月	11	3	0	0	0	0	27		30
	H 26年11月	2	1	1	1	1	0	24		27
	H 26年12月	8	5	3	3	5	0	28		39
利用者等の声	<ul style="list-style-type: none"> ・思ったより短時間で測定でき満足した。 ・顕微鏡では測定できなかったことが解決できた。 ・納入前の摩耗測定を定量的に行えた。 									
研究開発事例等	<ul style="list-style-type: none"> ・ある企業の新しく開発したプラスチック製の駆動部品の形状を測定、図面データとの比較解析し、新製品の開発を支援した。 ・ある企業の医療機器の金属部品の精密寸法測定と、旧製品との比較評価を行い、製品開発に当たっての品質検査を支援した。 ・ある企業の精密機器に用いる樹脂部品の重要寸法、幾何公差の測定を行い、製品開発に当たっての品質検査を支援した。 									
補助事業概要の広報資料	http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h25/pdf/25-127koho.pdf									

事業者名	埼玉県									
機器名	走査型電子顕微鏡									
写真										
特徴・用途	試料表面の拡大像の観察、未知物質を分析する。									
設置場所	埼玉県産業技術総合センター									
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)	
					件数(件)	時間(時間)				
	H 26年1月									0
	H 26年2月									0
	H 26年3月	1	1	1	0	0	0	0	7	8
	H 26年4月	10	10	2	7	8	30	0	16	33
	H 26年5月	13	13	1	3	8	33	0	26	38
	H 26年6月	19	19	23	2	8	35	2	23	58
	H 26年7月	18	18	14	1	12	48	1	27	55
	H 26年8月	16	16	7	2	10	46	1	24	44
	H 26年9月	15	15	0	2	17	83	1	36	56
	H 26年10月	22	22	4	2	15	66	0	32	53
	H 26年11月	16	16	0	0	13	63	0	32	45
H 26年12月	18	18	0	1	15	72	1	35	52	
利用者等の声	<ul style="list-style-type: none"> ・導入するには時間、お金、場所がかかるので、県内に、このような設備があり、助かった。今後のために積極的に利用したい。 ・旧機種よりも高倍率側が観察しやすくなった。 ・従来に比べピントの合わせが容易でとても楽だった。開発材料の形状だけでなく破損の率まで推定でき思わぬ成果があった。 ・アプリケーションソフトが分かりやすかった。勘で判断していた部分が明解になった。 ・観察したい箇所がピンポイントで見ることができ、今後の開発・研究結果の確認等に生かせる。 									
研究開発事例等	<ul style="list-style-type: none"> ・化粧品の添加物を観察し、効用が形状に関係していることがわかった。形状を制御することによって、大手化粧品メーカーのOEMが決まった。 ・特殊な表面処理がどれぐらいの深さまで入っているのかを確認するのに、光学顕微鏡では分解能が足りなかったが、電子顕微鏡で確認することができた。これによって、今後の研究開発が効率的に行えそうである。 ・半導体の表面観察を行い、表面性状の確認とデータの収集を行うことで、半導体部品に使用するレジスト剥離液の開発を支援した。 ・ある製品の表面の観察と分析を行うことで、付着異物を特定し、企業の製品開発における品質改善を支援した。 									
補助事業概要の広報資料	http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h25/pdf/25-127koho.pdf									